有機酸錯体法によるCuBi2O4の調製とキャラクタリゼーション

土居 茜*・小畑 賢次・松嶋 茂憲

Preparation and characterization of CuBi₂O₄ powders by organic acid complex method Akane DOI • Kenji OBATA • Shigenori MATSUSHIMA

Abstract

CuBi₂O₄ powders were prepared from a malonic acid complex and characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), UV-vis diffuse reflectance spectra (DRS) measurements and scanning electron microscope (SEM) observation. The single phase of CuBi₂O₄ crystal was formed even after heated at 500 °C in air. The obtained CuBi₂O₄ powders had a crystallite size of 47.3 nm and a specific surface area of 2.89 m²/g. The mean particle size of CuBi₂O₄ was ca. 0.2 μ m from a SEM observation. The electronic structure of CuBi₂O₄ was calculated by using the generalized gradient approximation considering on-site Coulomb interaction between d-electrons (GGA+U). As the result, it was found that CuBi₂O₄ is an indirect gap material and the band gap energy is calculated to be 2.4 eV.

Keywords: CuBi₂O₄, Photocatalyst, Malonic acid complex, First-principle calculation

1. 緒言

CuBi₂O₄は金属光沢を持つ黒色の結晶で、鉱物学分野 では草地鉱として知られている(Fig. 1)。物性分野で は、銅酸化物系高温超伝導体の発見以来、CuBi₂O₄が超 伝導を示さない理由と構造的・磁気的性質との関係が 長年調べられてきた。最近では、光触媒分野において 可視光応答が可能な触媒材料として注目されている¹⁾。 従来、CuBi₂O₄は固相反応法によって調製されてきた²⁻⁴⁾。 しかしながら、固相反応法によって調製されてきた²⁻⁴⁾。 しかしながら、固相反応法によって調製されてきた²⁻⁴⁾。 しかしながら、固相反応法によって調製されてきた²⁻⁴⁾。 しかしながら、固相反応法によって調製したCuBi₂O₄は、 期待されるほどの触媒活性を示していないのが現状で ある。これに対して、有機酸を用いたMarcillyらの方法 では、固相反応法よりも低い焼成温度で目的物質が得 られるという特徴がある⁵⁾。

本研究では、有機酸としてマロン酸を用いて調製したCuBi₂O₄を用いて、詳細なキャラクタリゼーション及び第一原理エネルギーバンド計算を実施した。



Fig. 1 Crystal structure of CuBi₂O₄.

*物質化学工学専攻2年

2. 実験方法

マロン酸錯体法では、出発原料としてBi(NO₃)₃·5H₂O, Cu(NO₃)₂·3H₂O 及びマロン酸を用い、これらを2:1:3 のモル比で3M-HNO₃中に溶解させた。この溶液をホッ トプレート上で加熱し、脱水,蒸発乾固を行った後、メ ノウ乳鉢で粉砕したものを前駆体粉末とした。得られ た前駆体粉末を、昇温速度10 ℃/min,空気中12時間, 500~800 ℃の温度範囲で焼成した。一方、固相反応法 では出発原料にα-Bi₂O₃とCuOを用い、1:1の割合で混 合し、同じ条件で焼成した。

調製した試料の結晶構造は、粉末X線回折測定 (XRD) により評価した。測定には、XRD装置(株式会 社リガク製, Ultima IV) を使用し、X線源: Cu-Ka 線, 管電圧-管電流: 30 kV-20 mA, 走査範囲: 10 °- 80 °, ス キャン速度: 2.0 °/min, サンプリング角度: 0.01 °, 積算 回数:3回の測定条件とした。比表面積は、比表面積装 置 (QUANTACHROME INSTRUMENTS 社製, NOVA 1200e) を用いて、BET (Brunauer-Emmett-Teller) 法によ り測定を行った。測定は、吸着ガスにN2ガス (99.999 % 以上)を用い、多点法 (相対圧0.1 < P/P₀ < 0.3) で実施し た。粉体試料の拡散反射スペクトル測定は、UV-vis 分 光光度計 (日本分光製, JASCO V-550) を用いて行い、 測定条件は測定モード:Abs,レスポンス:Medium, バンド幅: 5.0 nm, 走査速度: 400 nm/min, 開始波長: 800 nm, 終了波長: 250 nm, データ取込間隔: 1.0 nmと した。また、CuBi₂O₄の固体電子構造に関する知見を得 るために、d電子同士のクーロン反発及び交換相互作用 を考慮したGGA+U法に基づく計算を行った^{6,7)}。エネル ギーバンド計算は、最も高精度なFLAPW (full-potential linearized augmented plane wave) 法で実施した。

3. 結果及び考察

Fig. 2には、固相反応法及びマロン酸錯体法によって 得られた試料に関するXRDパターンを示している。固



Fig. 2 XRD patterns of $CuBi_2O_4$ powders prepared from the solid-state reaction (a) and the malonic acid complex (b).

相反応法では、前駆体粉末を500 °C及び600 °Cで焼成す ると、CuBi₂O₄に関する回折ピークが見られるものの、 不純物相であるCuOやBi₂O₃に帰属される回折ピークも 観察された。700 °C以上の温度で焼成すると、不純物相 に関する回折ピークが消失し、CuBi₂O₄のみの回折ピー クが認められた。一方、マロン酸錯体法では、400 °Cに おいてCuOやBi₂O₃の不純物相に起因するピークが現れ るが、500 °C以上ではCuBi₂O₄に関する回折ピークのみ が観察された。従って、固相反応法よりもマロン酸錯 体法の方が、より低温でCuBi₂O₄の単相が得られること が明らかとなった。次に、下記のScherrer式を適用して、 CuBi₂O₄の(211) 反射のピークから結晶子サイズを求め た⁸。

 $\mathbf{D} = \mathbf{K} \cdot \boldsymbol{\lambda} / (\boldsymbol{\beta} \cdot \cos \theta) \qquad (1)$

D :結晶子サイズ

- K : Scherrer定数(=0.9)
- λ:測定X線波長
- β:結晶子の大きさによる回折線の拡がり
- θ:回折線のブラッグ角

その結果、マロン酸錯体法では500,600及び700°Cにお

Table 1 Specific surface area of CuBi₂O₄ by BET method.

Preparation method	Temperature / °C	Specific surface area / m ² /g
Malonic acid complex	500	2.89
Solid-state reaction	700	0.33



Fig. 3 SEM images of $CuBi_2O_4$ powders from the malonic acid complex method (a) and the solid-state reaction method (b).

いて各々 47.3, 54.4, 64.0 nmと見積もられた。これに対 して、固相反応法では、単相の得られる700 °Cにおいて 67.5 nmであった。Table 1 には、試料粉体のBET 比表 面積を示している。マロン酸錯体法で調製した試料の 比表面積は、500 °C において2.89 m²/gと算出された。 これは、固相反応法で調製された試料 (700 °C)の比 表面積の約6倍である。従って、マロン酸錯体法では、 高比表面積を持つ単相のCuBi₂O₄が得られることが明ら かである。

Fig. 3には、CuBi₂O₄のSEM写真を示している。マロ ン酸錯体法で調製した試料は、500 ℃で熱処理した時の 平均粒子径が0.2 µm程度であることがわかった。 Scherrer式から見積もられる結晶子径は、500 ℃におい て47.3 nmである。このことは、SEM写真中の個々の粒 子がいくつかの結晶子の集まりであることを示唆して いる。一方、マロン酸錯体法と比較して、固相反応法 で調製した試料の粒子が非常に粗大であることがSEM 写真より明らかである。



Fig. 4 XPS spectra of CuBi₂O₄.

Fig. 4 は、CuBi₂O₄に関して得られた XPS スペクトル を示している。文献との比較から、CuBi₂O₄ 中の Bi は +3 価, O は-2 価で存在すると考えられる⁹。一方、 Cu2p_{3/2} に関して測定された束縛エネルギーは、CuO に 関する文献値よりも 0.4~1.0 eV 程度大きい。しかしな がら、Cu のような遷移金属元素では、一般に束縛エネ ルギーよりもサテライトピークの有無によって価数が 判別される。Cu₂O では、サテライトピークはほとんど 認められず、CuO において明瞭に出現することが知ら れている¹⁰⁾。**Fig.** 4 では、Cu2p_{3/2} と Cu2p_{1/2}の中間に比 較的大きなサテライトピークが認められていることか ら、CuBi₂O₄中の Cu は+2 価で存在すると考える方が妥 当である。

Fig. 5には、マロン酸錯体法で調製した試料に関する 拡散反射スペクトルを示している。焼成温度の上昇と ともに、基礎吸収の立ち上がりが長波長側へシフトす る傾向が見られた。基礎吸収領域は620~850 nmに広が っており、620~715 nmと715~850 nmの2つの領域に大 きく分けられる。吸収係数αは、バンド間遷移の吸収端 において次式に従うことが知られている¹¹⁾。

(2)

 $\alpha = A(hv-Eg)^n / hv$ h: Plank定数 v : 光の振動数 $E_g : エネルギーギャップ$ A: 定数

ここで、直接遷移の場合はn = 0.5、間接許容遷移の場合 はn = 2、間接禁制遷移の場合はn = 3となる。しかしなが ら、CuBi₂O₄ではn = 1の場合に最もよい直線性がln (α hv) vs. ln (hv-E_g)ⁿプロットに関して得られた。この値は、い ずれの遷移の場合にも該当していないので、実験的に は光学遷移のタイプを決定できない。そこで、第一原 理エネルギーバンド計算からの遷移形式の決定を以下 で試みた。

Fig. 6には、CuBi₂O₄のエネルギーバンド図を示している。GGA+U計算ではエネルギーギャップが約 2.4 eVとなり、CuBi₂O₄の単結晶に関して報告されている実験値がほぼ再現された¹²⁾。また、価電子帯の頂上は X 点付近,伝導帯の下端は Γ 点付近にあることがわかる。このことは、CuBi₂O₄が間接遷移型の酸化物であることを明瞭に示している。

4. 結論

本研究では、マロン酸錯体法によりCuBi₂O₄の調製し、 キャラクタリゼーション及び第一原理エネルギーバン ド計算を実施した。得られた主な結果を以下に列挙す る。

- (1) XRD測定から、固相反応法では不純物であるCuOや Bi₂O₃に帰属される回折ピークが700 ℃以上で消失し、 CuBi₂O₄の単相が得られた。
- (2) マロン酸錯体法では、500 ℃においてCuBi₂O₄の単 相が得られた。
- (3) マロン酸錯体法で調製した試料(500 ℃)の比表面積 は、固相反応法で調製した試料(700 ℃)の約6倍で あった。

- (4) XPS測定より、CuBi₂O₄中のBiは+3価,Oは-2価,Cu は+2価で存在すると考えられる。
- (5) マロン酸錯体法から得られた CuBi₂O₄の拡散反射ス ペクトルは、焼成温度の上昇とともに基礎吸収の立 ち上がりが長波長側へシフトした。
- (6) 第一原理エネルギーバンド計算より、CuBi₂O₄ は間 接遷移型であることが明らかとなった。



Fig. 5 UV-vis diffused reflectance spectrum for the precursor powders calcined at various temperature in air.



Fig. 6 Energy band structure of up-spin states for antiferromagnetic $CuBi_2O_4$.

<参考文献>

- T. Arai, Y. Konishi, Y. Iwasaki, H. Sugihara, K. Sayama, J. Comb. Chem. 9 (2007) 574.
- 2) J.P. Attfield, J. Phys.: Condens. Matter 1 (1989) 7045.
- E.W. Ong, G.H. Kwei, R.A. Robinson, B.L.Ramakrishna, R.B. Von Dreele, *Phys. Rev. B* 42 (1990) 4255.
- 4) K. Yamada, K. Takada, S. Hosoya, Y. Watanabe, Y. Endoh, N. Tomonaga, T. Suzuki, T. Ishigaki, T. Kamiyama, H. Asano, F. Izumi, *J. Phys. Soc. Jpn.* 60 (1991) 2406.
- 5) C. Marcilly, P. Courty, B. Delmon, J. Am. Ceram. Soc. 53 (1970) 56.
- 6) P. Blaha, K. Schwarz, G. K. H. Madsen, D. Kvasnicka, J. Luitz, WIEN2K, An Augmented Plane Wave + Local Orbitals Program for Calculating Crystal Propaties (Karlheinz Schwarz, Techn. Universitat Wien, Austria) (2001) ISBN 3-9501031-1-2.
- V. I. Anisimov, F. Aryasetiaman, A. I. Lichtenstein, J. Phys.: Conders. Matter 9 (1997) 767.
- B.D. Cullity, "Elements of X-ray Diffraction"; 2nd Edition, Addison-wesley Publising Company, Inc., reading, MA (1978).
- J.F. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, K.D. Bomben "Handbook of X-Ray Photoelectron Spectroscopy", Perkin-Elmer Corporation, Physical Electronics Division, Eden Prairie, Minn. (1992).
- J. Ghijsen, L. H. Tjeng, J. van Elp, H.Eskes, J.Westerink, G. A. Sawatzky, *Phys. Rev. B* 38 (1988) 11322.
- Demiryont H and Sites J R, J. Vac. Sci. Technol. A 2 (1984) 1457.
- A. Goldoni, U. D. Pennino, F. Parmigiani, L. Sangaletti, A. Revcolevschi, *Phys. Rev. B* 50 (1994) 10435.

(2012年11月12日 受理)